



关于团体标准 T/CASAS 057—2025《高频开关应用下 GaN 功率器件 开关运行状态可靠性试验方法》发布的通知

各成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，团体标准 T/CASAS 057—2025《高频开关应用下 GaN 功率器件开关运行状态可靠性试验方法》已遵照流程完成制定工作，现予以发布。

**T/CASAS 057—2025《高频开关应用下 GaN 功率器件开关运行状态
可靠性试验方法》**

本文件主要起草单位：厦门三安集成电路有限公司、湖南三安半导体有限责任公司、中山大学、广东工业大学、电子科技大学（深圳）高等研究院、深圳平湖实验室、苏州晶湛半导体有限公司、中国科学院半导体研究所、诸暨市氮矽科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、江苏能华微电子科技发展有限公司、杭州长川科技股份有限公司、深圳市大能创智半导体有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：叶念慈、刘成、徐涵、严丹妮、许亚坡、刘扬、贺致远、明鑫、曾威、王小明、王文平、戴婷婷、罗卓然、向鹏、贾利芳、刘家才、菅端端、武乐可、孙海洋、耿霄雄、谢斌、高伟。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2025年8月29日

